

8935

高产能的图案晶圆检测系统，可检测各种影响半导体芯片良率和可靠性的关键缺陷

优势： 8935以其高效的产量、在线缺陷检测和分类可以协助汽车芯片制造商：

- 准确识别并快速解决可能影响最终芯片质量的生产工艺问题
- 在关键工艺步骤监控对所有晶圆上所有芯片进行监控以实现零缺陷筛选策略，在成本最低的供应链源头就剔除可能发生故障的芯片。
- 通过提供可扩展、经济高效的平台并用以生产新器件和转向更小的工艺节点，该平台的高检测灵敏度和 AI 技术可以协助检测关键缺陷，同时其高产量可以协助完成100%监控和筛选策略

技术：

- 使用高数值孔径光学系统的多模式LED扫描功能
- 高分辨率操作模式
- DefectWise®人工智能缺陷检测和分类技术
- DesignWise™和FlexPoint™精确区域检测技术
- 先进的噪声抑制算法
- I-PAT®在线筛选解决方案

应用：

- 在线工艺监控，针对批次和晶圆进行高采样以降低偏移风险
- 工艺设备监控
- 图案晶圆的最终出厂质量控制
- 采用I-PAT 的全自动芯片级筛选解决方案



市场：
用于汽车、物联网、5G、消费电子、工业（军事、航空航天、医疗）的较大工艺节点器件的芯片制造

平台：

- 可定制的配置
- 可扩展
- 可升级

晶圆尺寸：

- 300mm
- 200mm
- 150mm

更多信息： www.kla.com/products/chip-manufacturing/defect-inspection-review#product-8-series